

03; 07; 12

© 1991 г.

**МНОГОКАДРОВАЯ СВЕРХСКОРОСТНАЯ
ЛАЗЕРНАЯ ШЛИРЕН-СИСТЕМА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ПРЕДПРОБИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЖИДКОСТЯХ
В НАНОСЕКУНДНОМ ДИАПАЗОНЕ**

B. F. Климкин

Представлены результаты, касающиеся создания и применения шестикадровой сверхскоростной шлирен-системы для изучения начальной стадии электрического пробоя в жидкостях. Система основана на малогабаритной линии световой задержки, позволяющей сравнительно просто и плавно регулировать временной интервал между кадрами в пределах ~ 5 — 50 нс. В качестве источника подсветки использовался рубиновый лазер с длительностью импульса ~ 5 нс. Пространственное (статическое) разрешение шлирен-системы составляет ~ 20 — 25 мкм. Эффективность системы продемонстрирована при наблюдении быстроменяющихся предпробивных процессов в жидкостях в наносекундном диапазоне.

Введение

Значительный прогресс при исследовании механизма электрического разряда в жидкостях достигнут в связи с применением лазерной техники. Объясняется это тем, что сочетание лазерных источников света с известными оптическими методами (шлирен-методы, интерферометрия и др.) позволяет удовлетворить требованиям высокого временного и пространственного разрешения, что особенно важно при изучении начальной стадии пробоя. Следует отметить, что высокое временное разрешение может быть получено при использовании электронно-оптических преобразователей, однако ухудшение качества изображения ЭОП при наносекундных экспозициях ограничивает возможности их применения при изучении микрообъектов, изменяющихся с большими скоростями.

Первые советские исследования физической картины электрического разряда в жидкостях с использованием рубинового лазера в качестве источника подсветки в схеме высокоскоростного шлирен-фотографирования были выполнены в 1970—1971 г. [1, 2]. Это позволило впервые наблюдать пробой с анода в однородном поле и выявить некоторые важные детали его зарождения и развития. Полученные результаты показали перспективность данного направления исследований, которое получило интенсивное развитие в последующие годы. Применение многокадровых систем позволяет более надежно изучать динамику развивающихся процессов. Например, в [3, 4] с помощью трехкадровой лазерной шлирен-системы удалось более детально исследовать различные стадии электрического разряда в дистиллированной воде. Дальнейшее развитие нового экспериментального подхода к исследованию механизма электрического разряда в жидкостях связано с совершенствованием методов и техники сверхскоростной оптической регистрации. Особенности электрического разряда в жидкостях (многообразие и сложность явлений, малые характерные размеры ≤ 10 мкм, высокие скорости развития $\sim 10^5$ — 10^7 см/с) позволяют выделить ряд требований, предъявляемых к методам высокоскоростных оптических измерений: 1) высокое временное и пространственное разрешение: например, изучение явлений, развивающихся со скоростью $\sim 10^5$ — 10^7 см/с, с динамическим пространственным разрешением ~ 10 мкм требует длительности импульсов под-

светки $\sim 10-0.1$ нс; 2) высокая скорость регистрации: для изучения процессов с характерным временем развития $\sim 10-100$ нс требуется частота съемки $\sim 10^3-10^8$ кадр/с; 3) изменение интервала между кадрами в широком диапазоне ($\sim 1-100$ нс); 4) высокая точность синхронизации кадров.

В кадровом режиме съемки требуемое число кадров составляет, как правило, 4-7. Энергия светового пучка должна быть достаточной для получения последующих кадров с соответствующей задержкой. Необходимо также сравнительно высокое качество пучка для получения надежных количественных данных. Схемы многокадрового фотографирования, основанные на линиях световой задержки с лазерным источником освещения [5], удовлетворяют этим требованиям в значительной степени.

В данной работе приведено описание шестикадровой сверхскоростной шлирен-системы и представлены результаты ее применения для наблюдения предпробивных явлений в жидкостях в наносекундном диапазоне.

Краткое описание шлирен-системы

Шлирен-система состоит из малогабаритной линии световой задержки, зеркально-призменного блока для сведения пучков и приемного устройства [6]. На рис. 1, а представлена принципиальная оптическая схема шлирен-системы без приемного устройства. Линия световой задержки включает в себя два основ-

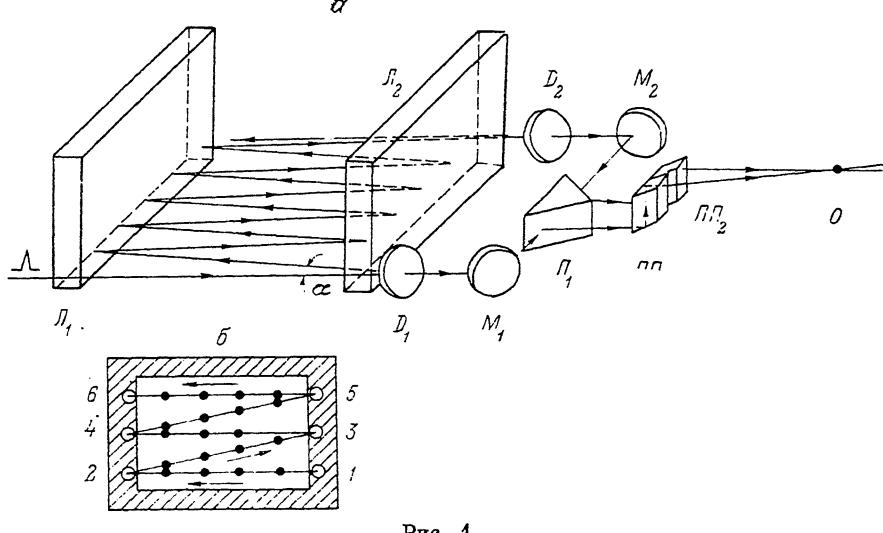


Рис. 1.

а — принципиальная оптическая схема шлирен-системы: L_1 , L_2 — основные зеркала линии световой задержки; D_1 , D_2 — делительные пластины; M_1 , M_2 — поворотные зеркала; P_1 — призма; O — исследуемый объект; P_1P_2 , P_2P_1 — перископические призмы; б — схематическое изображение работы зеркала L_2 ; линии световой задержки: темные кружки — изображения пучков на поверхности зеркала при последовательных отражениях, 1-6 — отверстия в оправе зеркала для вывода соответствующих пучков.

ных зеркала L_1 , L_2 и пять делительных пластин с плавно увеличивающимся коэффициентом пропускания. На рис. 1, а показаны только две делительные пластины D_1 и D_2 . Расстояние между зеркалами L_1 и L_2 составляло 70 см. Лазерный пучок вводится в линию световой задержки после отражения от первой делительной пластины D_1 . После ряда последовательных отражений от зеркал L_1 и L_2 пучок падает на вторую делительную пластину D_2 . Часть пучка проходит через нее, а основная часть отражается и снова вводится в линию световой задержки. Рис. 1, б поясняет работу зеркала L_2 . Видно, что временная задержка между пучками обеспечивается их многократными прохождениями между двумя основными зеркалами линии световой задержки. Меняя угол входления пучков α (управляя числом отражений в линии), можно сравнительно просто и плавно регулировать длительность задержки, не меняя расстояние между основными зеркалами. Рис. 1, а соответствует получению кадров I

и 2 (линия 1—2 на рис. 1, б). Таким образом, на выходе линии формируются шесть световых пучков, задержанных во времени и разделенных в пространстве. Расчет линии задержки проводился с учетом ослабления интенсивности пучков за счет дифракционной расходимости. Зеркально-призменный блок приближает пучки к главной оптической оси системы и направляет их на исследуемый объект (O на рис. 1, а) под малыми углами ($\sim 3 \cdot 10^{-2}$ рад). Он содержит в себе шесть дополнительных зеркал, три трехгранные призмы с отражающими гранями и четыре перископические призмы. На рис. 1, а показаны два дополнительных зеркала M_1 и M_2 , одна трехгранные призма P_1 , две перископические призмы PP_1 и PP_2 . Аналогичная оптическая схема используется при получении кадров 5 и 6. В схеме формирования кадров 3, 4 перископические призмы не используются. Применное устройство включает в себя шесть специально отобранных объективов с фокусным расстоянием 30 см, апертурные диафрагмы и шесть фотоаппаратов «Зенит-Е». Анализ пространственной разрешающей способности позволил определить влияние наклонного падения пучков на величину предельного разрешения. Оценки предельного (статического) разрешения шлирен-системы с учетом свойств фотоматериала показали, что оно находится в пределах 20—25 мкм. Чувствительность шлирен-системы при регистрации градиентов показателя преломления зависела от апертуры объективов ($\sim 5 \times 10^{-2}$ рад). В кадровом режиме съемки временное разрешение определяется длительностью экспозиции кадра. В качестве источника подсветки использовался рубиновый лазер с длительностью импульса около 15 нс. Для улучшения временного разрешения время экспозиции кадра было уменьшено до ~ 5 нс путем использования схемы «обострения» лазерного импульса источника освещения [7]. Настройка шлирен-системы и установка импульсного лазера осуществляются с помощью гелий-неонового лазера.

Шлирен-система позволяет получить при одном включении рубинового лазера шесть кадров с длительностью экспозиции каждого кадра ~ 5 нс и легко регулируемым (не обязательно равномерным) временным интервалом между ними в пределах ~ 5 —50 нс. Следует отметить, что по временному и пространственному разрешению, скорости регистрации она превосходит экспериментальную технику, обычно применяемую при изучении начальной стадии электрического пробоя в жидкостях (см., например, [8]).

Экспериментальные результаты

Шлирен-система была использована при исследовании динамики электрического разряда в жидкостях. Особенно эффективным оказалось ее применение при наблюдении быстременяющихся предпробивных процессов в наносекундном диапазоне. В качестве иллюстрации на рис. 2 приведены типичные шлирен-фотографии электрического разряда в дистиллированной воде (удельное сопротивление $\sim 10^5$ Ом·см) с анода при напряжении на промежутке 32 кВ (поле вблизи острийного электрода ~ 1.9 МВ/см). Условия эксперимента аналогичны описанным в [9]. Видно, что за характерное время $\leqslant 100$ нс удается проследить за зарождением и развитием электрического разряда в промежутке. Анализ большого числа шлирен-фотографий позволил выявить детали, касающиеся механизма пробоя в этих условиях. Его зарождение связано с возникновением вблизи острийного электрода первичных ионизационных (стримерных) каналов со слабым градиентом плотности. Развитие стримерных каналов сопровождается фазовым переходом, возникновением микропузырьков и их гидродинамическим расширением. Поперечный размер каналов увеличивается до нескольких десятков микрон, градиент плотности становится значительным, и они хорошо видны на шлирен-фотографиях. Кадры 1—4 на рис. 2 как раз и отображают эту стадию электрического разряда. Стримерные каналы распространяются по радиальным направлениям, поэтому начальное возмущение имеет примерно сферическую форму. Возможно, что картина несколько усложняется генерацией ударных волн в результате интенсивного поглощения энергии в стримерных каналах. Скорость развития разряда по данным кадров 1—4 составляет $\sim 3-4 \cdot 10^5$ см/с. Последующие кадры на рис. 2 показывают возникно-

вение и распространение более быстрой стадии электрического разряда. Ее зарождение происходит на фронте начального возмущения, соответствующего границе первичных стримерных каналов (кадр 4). Скорость развития стримерных каналов значительно увеличивается. Наблюдаются многочисленные их разветвления, электрический разряд имеет форму кисти (или куста) и сильно рассеивает внешний свет (темная область на фотографиях). Скорость распространения кистевого разряда по данным кадров 4—6 составляет $\sim 4 - 3 \cdot 10^6$ см/с и несколько уменьшается по мере продвижения в глубь промежутка. Впереди сильного возмущения (темная область) на кадре 6 видно множество стримерных каналов, слабо рассеивающих свет, некоторые из которых достигли катода. Кадр 6 на рис. 2 получен примерно за 2—3 нс до пробоя промежутка. Распр-

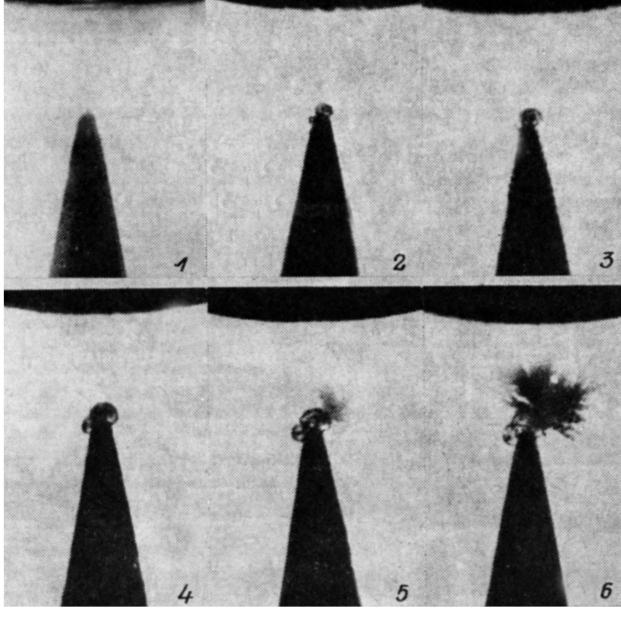


Рис. 2. Сверхскоростные лазерные шлирен-фотографии электрического разряда в воде с анодом.

Время запаздывания пробоя 90 нс. Расстояние между электродами 1 мм. Длительность экспозиции каждого кадра 5 нс. Временной интервал между первым и вторым кадрами 25 нм, между остальными — 10 нс.

странение ионизации с большой скоростью $\leq 2 \cdot 10^7$ см/с в последующий момент и завершает начальную стадию формирования электрического разряда. Именно высокая скорость регистрации шлирен-системы (до 100 млн кадр/с) как раз и позволила наблюдать переход к более быстрой стадии электрического разряда и ее развитие.

Установлено влияние структуры жидкости на механизм пробоя с анодом. Например, в прозрачном, хорошо очищенном трансформаторном масле (прочность по ГОСТу 70 кВ) возникновение стримерных каналов в промежутке носит случайный характер. Даже при более высоких напряженностях поля вблизи острыйного электрода ~ 3 МВ/см не происходит возникновения интенсивного кистевого разряда, когда скорости предпробивных процессов увеличиваются до $10^6 - 10^7$ см/с, что и определяет более высокую импульсную электрическую прочность масла по сравнению с дистиллированной водой. Получены другие интересные и важные результаты.

Применение шлирен-системы может оказаться полезным при исследовании сверхбыстрых процессов в газах, конденсированных средах и высокотемпературной плазме.

Автор искренне признателен В. А. Арбузову и В. П. Бородину за помощь при выполнении работы.

Список литературы

- [1] Алхимов А. П., Воробьев В. В., Климкин В. Ф. и др. // ДАН СССР. 1970. Т. 194. № 5. С. 1052—1054.
- [2] Абрамян Е. А., Корнилов В. А., Лагунов В. М. и др. // ДАН СССР. 1971. Т. 201. № 1. С. 56—59.
- [3] Климкин В. Ф., Пономаренко А. Г. // Вопросы газодинамики. Новосибирск, 1975. № 5. С. 260—262.
- [4] Климкин В. Ф., Пономаренко А. Г. // Тр. XIV Междунар. конгресса по высокоскоростной фотографии и фотонике. М., 1980. С. 385—389.
- [5] Островская Г. В., Островский Ю. И. // Письма в ЖЭТФ. 1966. Т. 4. Вып. 4. С. 121—124.
- [6] Арбузов В. А., Климкин В. Ф. // Тр. IV Всесоюз. конф. «Электрический разряд в жидкости и его применение в промышленности». Николаев, 1988. Ч. I. С. 76—77.
- [7] Klimkin V. F., Soloukhin R. I., Wolansky P. // Combust. and Flame. 1973. Vol. 21. N 1. P. 111—117.
- [8] Forster E. O. // IEEE Trans. Elec. Insul. 1985. Vol. 20. N 6. P. 905—912.
- [9] Климкин В. Ф. // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 16. Вып. 4. С. 54—58.

Новосибирский государственный университет
им. Ленинского комсомола

Поступило в Редакцию
30 августа 1990 г.